Searc	:h N	lotes
-------	------	-------



Applicat	ion/Con	trol No.
----------	---------	----------

09/873,311

Examiner

Nhan T. Tran

Applicant(s)/Patent under Reexamination

YAMAZAKI ET AL.

Art Unit

2622

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		<u>.</u>	-	
,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	•			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		,	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR ·
Updated EAST search (USPAT, PGPUB, JPO, EPO, DERWENT, IBM_TDB)	12/13/2006	NT
348/362-367 348/345-357 (text search - see search history printout)	12/13/2006	NT
·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		